

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	<b>Таперо Константин Иванович</b>
2	Дата рождения ( <b>полная</b> )	19.01.1970
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах»)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	С.н.с.
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	Московская обл., г. Лыткарино, Промзона Тураево стр. 8 <a href="http://www.niipriborov.ru/risi@niipribor.ru">http://www.niipriborov.ru/risi@niipribor.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборов"
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Администрация
	Должность	Заместитель генерального директора по науке и инновациям
7	<p align="center"><b>Основные публикации в области диссертационного исследования</b></p> <p>(для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих экономические науки: не менее 6 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 1 в WoS/Scopus, а также не менее 1 рецензируемой монографии):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A.S. Petrov, <b>K.I. Tapero</b>, V.N. Ulimov, A.M. Chlenov. Impact of elevated temperature applied during low dose rate irradiation on the degradation of BiCMOS operational amplifiers // Microelectron. Reliab. 88–90 961–964(2018).</li> <li>2. <b>K.I. Tapero</b>. Low Dose Rate Effects in Silicon-Based Devices and Integrated Circuits: A Review // Russ. Microelectron. 47 539–552 (2018).</li> <li>3. A. V Kir'yanov, Y.O. Barmenkov, V. Minkovich, S. Das, D. Dutta, A. Dhar, M.C. Paul, S.I. Didenko, S.A. Legotin, <b>K.I. Tapero</b>. Effect of electron irradiation on the optical properties of bismuth doped hafnia-yttria-alumina-silicate fiber // Opt. Mater. Express. 8 2550–2558 (2018).</li> <li>4. Петров А.С., Таперо К.И., Улимов В.Н. Исследование влияния низкоинтенсивного облучения при повышенной температуре на деградацию БИКМОП операционных усилителей // Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2018. Вып.1 с. 31-34.</li> <li>5. K. Tapero. "Single-Event Effects Test Methods". In book: "Radiation Effects on Inegrated Circuits and Systems for Space Applications", Ed. By R.Velazco, D. McMorro, J. Estela. Springer Nature Swizerland AG, 2019, pp. 39-60.</li> <li>6. A.S. Petrov, <b>K.I. Tapero</b>, A.M. Galimov, G.I. Zebrev. Degradation of bipolar transistors at high doses obtained at elevated temperature applied during gamma-irradiation // Microelectron. Reliab. 100–101 113378 (2019).</li> </ol>	

7. A. V Kir'yanov, A. Halder, E. Sekiya, K. Saito, Y.O. Barmenkov, V.P. Minkovich, S.I. Didenko, S.A. Legotin, **К.И. Таперо**. Impact of electron irradiation upon optical properties of Bismuth/Yttria codoped phosphosilicate fiber // Opt. Laser Technol. 128 106245 (2020).
8. Tapero K., Orlova M., Didenko S., Yurchuk S., Sizov S.  $A_{III}B_V$  Photoelectric Converters Degradation under Ionizing Radiation // Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies, MWENT 2020 – Proceedings, 2020.
9. Петров А.С., **Таперо К.И.**, Труфанов С.К. Радиационно-индуцированная деградация биполярных транзисторов при высокотемпературном гамма-облучении // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2020. Вып. 1 с. 5-8.
10. Рябцева М.В., Петров А.С., Воеводкин Г.С., **Таперо К.И.**, Вагапова Н.Т., Баньковский М.В. Исследование воздействия электронов, нейтронов и гамма-квантов на выходные характеристики трёхкаскадных фотоэлектрических преобразователей на основе  $A_{III}B_V/Ge$  // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2021. Вып. 2 с.16-22.
11. Воеводкин Г.С., Рябцева М.В., Бадурин И.В., Вагапова Н.Т., Логинова Е.С., **Таперо К.И.**, Петров А.С. Адаптирования методика оценки радиационной деградации фотоэлектрических преобразователей концентрированного солнечного излучения и их каскадов на базе InGaP, In GaAs и Ge // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2021. Вып. 3. с. 5-10.
12. M. V Ryabtseva, A.S. Petrov, G.S. Voevodkin, **К.И. Tapero**, N.T. Vagapova, M. V Bankovsky. Degradation of  $A_{III}B_V/Ge$  triple junction solar cells irradiated by gamma-rays, electrons and neutrons // Microelectron. Reliab. 125 114350 (2021).
13. I. V Shchemerov, S.A. Legotin, P.B. Lagov, Y.S. Pavlov, **К.И. Tapero**, A.S. Petrov, A. V Sidelev, V.S. Stolbunov, T. V Kulevoy, M.E. Letovaltseva, V.N. Murashev, M.P. Konovalov, V.N. Kirilov. Radiation effect on the polymer-based capacitive relative humidity sensors // Nucl. Eng. Technol. 54 2871–2876 (2022).

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
---	---------------------------------------------------------------------

9	Адрес электронной почты
---	-------------------------